#5 תרגיל בית

תאריך הגשה: 15.05.2002 עד השעה 12:00 יש לנמק היטב את כל התשובות

שאלה 1.

עליכם להשתמש ברכיבי זיכרון מסוג KM41C16000C-5 DRAM (שנלמדו בתרגול) על מנת לתכנן מערכת זיכרון חדשה ע"פ הדרישות הבאות:

- .64Mbit גודל הזיכרון של המערכת החדשה הינו
- . מרחב הכתובות של המערכת יהיה 2^{26} כתובות (כלומר הגישה אל הזיכרון נעשית ברזולוציה של ביט בודד).
- ם בצורה דומה $\overline{WE}, \overline{CAS}, \overline{RAS}$: מערכת הזיכרון תופעל על ידי שלושה סיגנלי בקרה $\overline{WE}, \overline{CAS}, \overline{RAS}$ בצורה דומה לסיגנלי הבקרה של רכיב ה DRAM שנלמד בתרגול.
- מתן הכתובת יתבצע בשני חלקים- כתובת שורה בת 14 סיביות ניתנת בהתאם לירידת CAS (כך ששתי הסיביות הגבוהות בכתובת השורה נשארות קבועות במהלך כל הפניה לזיכרון הטיביות הגבוהות לאיזה מבין ארבעת הרכיבים יש לפנות).
 - א. עליכם לשרטט מבנה סכמתי של המערכת.
 - ב. הסבירו מהם השינויים בין דרישות התזמון של מערכת הזיכרון שתכננתם לבין DRAM בהם השתמשתם.
 - ג. כעת נדרש לתכנן מערכת זיכרון חדשה עם אותה כמות זיכרון אך אשר הגישה אל הנתונים תעשה ברזולוציה של ארבעה ביטים (כלומר כל כתובת מייצגת ארבעה ביטים). שרטטו את המבנה הסכמתי של המערכת והסבירו מהן דרישות התזמון של מערכת זו.
- ד. סעיף בונוס תארו בניה של מערכת זיכרון כאשר עבורה מתן הכתובת יתבצע באופן הבא: כתובת שורה בת 13 סיביות ניתנת בהתאם לירידת RAS וכתובת עמודה בת 13 סיביות ניתנת בהתאם לירידת CAS. הסיבית הגבוהה בכתובת השורה והסיבית הגבוהה בכתובת העמודה הן המציינות באיזה רכיב יש להשתמש. שימו לב כי יש ריבוב של קווי הכתובת, כלומר כתובת השורה והעמודה ניתנים על אותם קווים.

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה להנדסת חשמל

<u>שאלה 2.</u>

במפעל היצור של חברת SAMSUNG המייצרת את רכיבי זיכרון ה DRAM מסוג 5-KM41C16000C חלה תקלה באחת המכונות וקווי הכתובת A1 ו- A1 קוצרו לקו הכתובת A10.

> א. הסבירו כיצד הדבר משפיע על גודל מרחב הזיכרון בו ניתן להשתמש. ב. חשבו כמה זמן ימשך רענון של רכיב הזיכרון בכל אחת משתי השיטות, CAS before RAS – 1 RAS only refresh

מהנדסי החברה גילו כי את התקלה בקו A0 ניתן למנוע כאשר הסיגנל \overline{CAS} גבוה מהנדסי הוא יהיה מקוצר לקו הכתובת A10 רק כאשר הסיגנל \overline{CAS} נמוך.

ג. כיצד התיקון שמציעים המהנדסים ישפיע על גודל מרחב הזיכרון בו ניתן להשתמש.

מהנדסי החברה גילו כי אם לא יבצעו את התיקון הנייל באפשרותם לבצע תיקון אחר מהנדסי החברה גילו כי אם לא יבצעו את התקלה בקו $\overline{CAS}, \overline{RAS}$ נמוכים בו זמנית.

ד. איזה מבין הזמנים שבדפי הנתונים של הרכיב מבטיח כי התיקון המוצע אכן יכול להביא לשיפור בגודל מרחב הזיכרון אליו ניתן לגשת!

<u>שאלה 3.</u>

ברצוננו להשתמש ברכיב זיכרון DRAM מסוג EM41C16000C-5 כחלק ממערכת סינכרונית. קריאת הנתונים מן הרכיב מתבצעת בשיטת FPM כאשר בכל מחזור שעון ניגשים לביט אחד.

מהו האילוץ על מחזור השעון על מנת שנוכל להשלים קריאה של שורה שלמה בשיטת FPM והאם ניתן לעמוד בו? ציינו את החישוב הינו אתם מבצעים.